《集成电路版图设计与Tanner EDA工具的使用》

书籍信息

版次:1 页数: 字数:

印刷时间:2009年05月01日

开本:16开 纸张:胶版纸 包装:平装 是否套装:否

国际标准书号ISBN: 9787560621968

丛书名:中国高等职业技术教育研究会推荐

高职高专电子、通信类专业"十一五"规划教材

内容简介

本书结合Tanner版图设计软件的使用方法,介绍了与版图设计相关的微电子技术。全书共8章,主要内容包括集成电路设计概论、CMOS电路设计基础、CMOS集成电路的物理结构、Tanner的L-Edit版图编辑器、设计规则检查和版图提取、使用L-Edit设计版图实例、Tanner的S-Edit电路图编辑器和电路图与版图一致性检查。本书选材合理,文字叙述清楚,可作为高职高专电子、通信类相关专业的教材使用,也可供集成电路设计人员参考。

目录

第1章 集成电路设计概论

- 1.1 集成电路发展概况
- 1.2 集成电路的设计特点和方法
- 1.3 集成电路设计流程简介
- 1.4 EDA工具介绍

习题

第2章 CMOS电路设计基础

- 2.1 晶体管知识简介
- 2.2 MOS晶体管开关
- 2.3 基本的CMOS逻辑门
- 2.4 逻辑设计相关基础知识简介 习题

第3章 CMOS集成电路的物理结构

- 3.1 版图设计的概念和方法
- 3.2 集成电路工艺简介
- 3.3 CMOS制造工艺简介
- 3.4 版图中的绘图层
- 3.5 CMOS晶体管的版图
- 3.6 版图的验证
- 3.7 版图输出数据
- 3.8 版图设计的通用准则
- 3.9 基本逻辑门的版图设计

习题

第4章 Tanner的L-Edit版图编辑器

- 4.1 Tanner版图设计工具介绍
- 4.2 L-Edit版图编辑器的启动和界面介绍
- 4.3 L-Edit的设置
- 4.4 L-Edit中的文件

- 4.5 文件的输入和输出
- 4.6 L-Edit中的单元
- 4.7 L-Edit中的绘图对象
- 4.8 L-Edit中的对象编辑
- 4.9 版图的衍生绘图层
- 4.10 版图的视图窗口
- 4.11 L-Edit中的横截面观察器

习题

第5章 设计规则检查和版图提取

- 5.1 设计规则检查
- 5.2 版图的提取

习题

第6章 使用L-Edit设计版图实例

- 6.1 使用版图编辑器画PMOS晶体管的版图
- 6.2 使用版图编辑器画NMOS晶体管的版图
- 6.3 使用版图编辑器画反相器的版图
- 6.4 使用版图编辑器画并联晶体管的版图
- 6.5 使用版图编辑器画串联晶体管的版图 习题

第7章 Tanner的S-Edit电路图编辑器

- 7.1 S-Edit电路图编辑器简介
- 7.2 电路图的设计
- 7.3 电路设计图的查看、绘制和编辑
- 7.4 电路图的连接关系
- 7.5 网表和仿真
- 7.6 实例
- 7.7 创建符号视图

习题

第8章 电路图与版图一致性检查

- 8.1 LVS比较器简介
- 8.2 LVS的设置和运行

习题

附录

附录A L-Edit版图编辑器中文件类型与扩展名对照表 附录B 设计导航界面符号解释

参考文献

在线试读部分章节

第1章 集成电路设计概论

- 1.2 集成电路的设计特点和方法
- 1.2.1 集成电路的设计特点

设计集成电路时除了关心其功能、性能之外,设计成本和设计周期也应该特别考虑。在进行设计的时候要正确进行功能配置,并设计合理的逻辑电路来实现其功能。集成电路的成本与芯片的面积有着密切的关系,芯片面积的增加会导致成本的提高。另外,设计周期与市场有着密切的联系,一个集成电路芯片要在市场抢得先机,就要尽量缩短设计周期。

集成电路是数量巨大的晶体管的集合,因此其设计不同于分立元件电路的设计,有其自身的特点。

(1)集成电路要采用分层设计和模块化设计相结合的设计方法。集成电路设计的最终结果是设计出能实现既定功能的掩膜版图。在一个芯片上集成了成千上百甚至几十万、几百万、上亿个晶体管,要在一个层次上实现这些晶体管的版图及其互连是不可能的,因此在集成电路设计中,通常采用分层设计和模块化设计相结合的设计方法。所谓分层设计,是指将集成电路的设计分为五个设计层次,即行为级设计、RTL级设计、门级设计、晶体管级设计和版图级设计。行为级设计是指用高级语言来建立行为模型,即用高级语言来实现设计的算法。RTL级设计是指描述寄存器之间数据的流动及数据的处理方法。门级设计是指设计逻辑门及其互连方式。晶体管级设计是指将逻辑门进一步用晶体管及互连关系来描述。版图级设计是指集成电路最终的掩膜版设计。

集成电路按功能通常可以划分为几个部分,每一部分的功能都可以用一个模块电路来 实现,这样在进行设计的时候就可以几个模块并行设计,以缩短设计周期,同时也便于 电路的测试和验证。

.

版权信息

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。 更多资源请访问www.tushupdf.com